

УДК 537.226.1

©1993

**СТРУКТУРА ДИПОЛЬНОГО ТЕНЗОРА
И ВЛИЯНИЕ ДИПОЛЬ-ДИПОЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
НА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
И ДЛИННОВОЛНОВЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ
РЕШЕТКИ В КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ДИЭЛЕКТРИКАХ
И ПОЛУПРОВОДНИКАХ**

O. E. Квятковский

Предлагается новый подход к описанию влияния дипольных сил на спектр длинноволновых оптических колебаний решетки в кристаллах со сложной решеткой. Показано, что после вычитания из дипольного тензора для сложной решетки дипольного тензора для решетки Браве кристалла оставшаяся часть, зависящая от взаимного положения подрешеток, в длинноволновом пределе эквивалентна близкодействующему взаимодействию, убывающему за пределами примитивной ячейки не медленнее чем R^{-5} . Это позволяет для выделенной дальнодействующей части диполь-дипольного взаимодействия свести задачу к решенной ранее автором задаче для кристаллов с простой решеткой и получить явное выражение для вклада дальнодействующих дипольных сил в дисперсионные частоты полярных оптических колебаний решетки, содержащее только экспериментально измеримые величины (тензоры $\hat{\epsilon}^{\infty}$ и дипольных сил осциллятора $\hat{f}(\alpha)$ для моды α) и матрицу дипольных структурных констант для решетки Браве кристалла. Выделенный дипольный тензор для решетки Браве кристалла описывает диполь-дипольное взаимодействие длинноволновых флуктуаций вектора поляризации \mathbf{P}^q , возникающих при полярных оптических колебаниях решетки под действием близкодействующей части электрон-электронного и электрон-ядерного взаимодействий. С использованием полученных результатов выполнены модельно-независимые расчеты вкладов дипольных сил в дисперсионные частоты полярных оптических мод с симметрией F_{1u} для SrTiO_3 , KTaO_3 , KCoF_3 и кубической фазы BaTiO_3 и KNbO_3 . Показано также, что асимптотическое поведение на больших расстояниях поля Лоренца в реальном пространстве для простой кубической решетки является сильно анизотропным и имеет дальнодействующий характер.

Диполь-дипольное ($D-D$) взаимодействие оказывает существенное влияние на диэлектрические и оптические свойства и динамику решетки в диэлектриках и полупроводниках [1–5]. Неаналитическая при $\mathbf{q} = 0$ часть $D-D$ взаимодействия (\mathbf{q} — приведенный волновой вектор), отвечающая за возникновение макроскопического электрического поля при длинноволновых оптических колебаниях решетки в полярных кристаллах,¹ может быть описана в рамках феноменологической теории [1, 2, 6, 7].

¹ Следуя [5, 7], будем называть кристаллы полярными, если их фоновый спектр содержит хотя бы одну полярную (диполь-активную) длинноволновую оптическую моду.

В кристаллах имеется также регулярная при $q = 0$ часть $D - D$ взаимодействия, обусловленная неоднородным распределением плотности заряда ядер и электронов, которая дает вклад в микроскопическое поле в поляризованном диэлектрике и существенно влияет на макроскопические диэлектрические параметры и спектр длинноволновых оптических колебаний решетки кристаллов [1–6].

Обычный подход к решению задачи о влиянии микроскопических полей на свойства поляризованного диэлектрика заключается в рассмотрении кристалла как упорядоченной совокупности неперекрывающихся (или слабо перекрывающихся) ионов, атомов или молекул, поляризуемых локальным действующим полем [1–5]. Такой подход позволяет свести исходную задачу для среды с непрерывным распределением плотности заряда электронов к более простой задаче для системы точечных диполей (и индуцированных мультиполей более высоких порядков), расположенных в узлах периодической решетки [1–5]. Существенным недостатком такого подхода является использование локального приближения для электронного отклика, характеризуемого набором электронных мультипольных поляризуместий ионов, атомов или молекул. Во многих случаях (соединения с ковалентно-ионной связью, полупроводники), когда спектр электронных возбуждений кристалла является зонным и значительно отличается от спектра возбуждений составляющих элементов (ионов или атомов), локальное приближение неадекватно описывает электронный отклик кристалла [5]. Другим недостатком локального приближения является то, что используемые параметры, например заряды и поляризумости ионов, не совпадают с соответствующими характеристиками свободных ионов и фактически являются подгоночными параметрами модели, не имеющими точного микроскопического смысла.

В работе [6] показано, что задача о влиянии $D - D$ взаимодействия на диэлектрические свойства и спектр длинноволновых оптических колебаний решетки кристаллических диэлектриков и полупроводников в гармоническом приближении может быть решена точно для случая, когда матрица дипольных структурных коэффициентов кристалла полностью определяется его решеткой Браве, т.е. сингонией кристалла.² Это условие является ограничительным при рассмотрении динамики решетки кристаллов, что связано с тем, что как межъядерное, так и электрон-ядерное $D - D$ взаимодействия, возникающие при смещении ядер из равновесных положений, зависят в общем случае от положения атомов в примитивной ячейке кристалла [1, 2, 5]. Исключением являются двухатомные кубические кристаллы, для которых такая зависимость отсутствует [1, 2].

В данной работе показано, что полученное в [6] решение задачи о влиянии $D - D$ взаимодействия на диэлектрические свойства и динамику решетки кристаллов допускает непосредственное обобщение на случай кристаллов произвольной симметрии, что оказывается возможным благодаря структуре дипольного тензора в кристаллах.

Как будет показано в разделе 1, дипольный тензор состоит из двух частей, одна из которых содержит вклад сильнодействующей части $D - D$ взаимодействия (убывающей как R^{-3} при $R \rightarrow \infty$, где R — вектор решет-

² С помощью техники многочастичной теории возмущений [8] можно показать [9], что результаты, полученные в [6], сохраняют силу при учете ангармонизма колебаний решетки и при конечных температурах.

ки Браве) и полностью определяется решеткой Браве кристалла. Вторая часть дипольного тензора зависит от взаимного положения подрешеток, но при $\mathbf{q} = 0$ содержит лишь вклад близкодействующей части $D-D$ взаимодействия (убывающей за пределами примитивной ячейки не медленнее, чем R^{-5}).

Таким образом, полученное в [6] решение сохраняет силу для дальнодействующей части $D-D$ взаимодействия в кристаллах произвольной симметрии. В разделе 2 приведены результаты решения задачи о влиянии $D-D$ взаимодействия на тензоры электронной (оптической) диэлектрической проницаемости $\hat{\epsilon}^{\infty}$ и макроскопического (поперечного) эффективного заряда $\hat{Z}(s)$ и точное выражение для вклада дальнодействующей, регулярной при $\mathbf{q} = 0$ части $D-D$ взаимодействия в регулярную при $\mathbf{q} = 0$ (механическую) часть матрицы силовых постоянных кристалла $\hat{\Phi}(0, st)$, т.е. для $\hat{\Phi}^{DD}$. Показано, что $\hat{\Phi}^{DD}$ можно выразить через макроскопические диэлектрические параметры $\hat{\epsilon}^{\infty}$ и $\hat{Z}(s)$ и регулярную при $\mathbf{q} = 0$ часть коэффициента Фурье $\hat{A}(0)$ дипольного тензора для решетки Браве кристалла.

В разделе 3 получено явное выражение для вклада дальнодействующей, регулярной при $\mathbf{q} = 0$ части $D-D$ взаимодействия в дисперсионную частоту $\bar{\omega}(\alpha)$ произвольного длинноволнового полярного оптического колебания решетки, точнее выражение для $\bar{\omega}_{DD}^2(\alpha)$, которое содержит только экспериментально измеряемые величины ($\hat{\epsilon}^{\infty}$ и тензор $\hat{f}(\alpha)$ дипольных сил осциллятора для рассматриваемой моды α) и тензор дипольных структурных констант $\hat{A}(0)$ для решетки Браве кристалла.

В разделе 4 с использованием экспериментальных данных выполнены безмодельные расчеты $\bar{\omega}_{DD}^2(\alpha)$ для трех полярных оптических мод с симметрией F_{1u} для нескольких соединений с кубической структурой перовскита (BaTiO_3 , SrTiO_3 , KNbO_3 , KTaO_3 и KCoF_3) и обсуждается природа сегнетоэлектрической неустойчивости решетки в оксидах переходных металлов со структурой перовскита.

В Приложении приведен вывод асимптотического выражения для поля Лорентца в реальном пространстве при $\mathbf{R} \rightarrow \infty$ для простой кубической решетки.

1. Структура дипольного тензора для сложной решетки

Рассмотрим зависящий от волнового вектора коэффициент Фурье дипольного тензора для сложной решетки [1, 2, 6]

$$Q_{ij}(\mathbf{q}, st) = \sum_{\mathbf{R}}' e^{-i\mathbf{q}(\mathbf{R} + \mathbf{R}_s - \mathbf{R}_t)} \nabla_i \nabla_j \frac{1}{|\mathbf{R} + \mathbf{R}_s - \mathbf{R}_t|}, \quad (1)$$

где $\nabla_i = \partial/\partial x_i$; \mathbf{R} — вектор решетки Браве кристалла; \mathbf{R}_s — базисный вектор, определяющий положение в примитивной ячейке атома из подрешетки сорта s . Штрих у знака суммы в (1) означает условие $\mathbf{R} + \mathbf{R}_s - \mathbf{R}_t \neq 0$. Тензор $\hat{Q}(\mathbf{q}, st)$ можно представить в виде [1]

$$Q_{ij}(\mathbf{q}, st) = -\frac{4\pi}{v_0} n_i n_j + \bar{Q}_{ij}(\mathbf{q}, st), \quad \mathbf{n} = \mathbf{q}/q, \quad (2)$$

где $\hat{Q}(\mathbf{q}, st)$ — регулярная при $\mathbf{q} = 0$ часть коэффициента Фурье дипольного тензора для сложной решетки, а v_0 — объем примитивной ячейки.

Рассмотрим также коэффициент Фурье дипольного тензора для решетки Браве кристалла

$$Q_{ij}(\mathbf{q}) = \sum_{\mathbf{R} \neq 0} e^{-i\mathbf{q}\mathbf{R}} \nabla_i \nabla_j \frac{1}{R} = -\frac{4\pi}{v_0} n_i n_j + A_{ij}(\mathbf{q}). \quad (3)$$

Вычитая (3) из (2), находим, что

$$\bar{Q}_{ij}(\mathbf{q}, st) = A_{ij}(\mathbf{q}) + \begin{cases} 0, & s = t, \\ \gamma_{ij}(\mathbf{q}, st), & s \neq t, \end{cases} \quad (4)$$

где

$$\gamma_{ij}(\mathbf{q}, st) = \sum_{\mathbf{R}}' e^{-i\mathbf{q}\mathbf{R}} \left\{ e^{-i\mathbf{q}(\mathbf{R}_s - \mathbf{R}_t)} \nabla_i \nabla_j \frac{1}{|\mathbf{R} + \mathbf{R}_s - \mathbf{R}_t|} - \nabla_i \nabla_j \frac{1}{R} \right\}. \quad (5)$$

Выражение в правой части равенства (5) можно преобразовать к виду

$$\begin{aligned} \gamma_{ij}(\mathbf{q}, st) = & \left(e^{-i\mathbf{q}(\mathbf{R}_s - \mathbf{R}_t)} - 1 \right) Q_{ij}(\mathbf{q}) + e^{-i\mathbf{q}(\mathbf{R}_s - \mathbf{R}_t)} \nabla_i \nabla_j \frac{1}{|\mathbf{R}_s - \mathbf{R}_t|} + \\ & + \sum_{\mathbf{R} \neq 0} e^{-i\mathbf{q}(\mathbf{R} + \mathbf{R}_s - \mathbf{R}_t)} \nabla_i \nabla_j \left\{ \frac{1}{|\mathbf{R} + \mathbf{R}_s - \mathbf{R}_t|} - \frac{1}{R} \right\}. \end{aligned} \quad (6)$$

Первое слагаемое в правой части равенства (6) обращается в нуль при $\mathbf{q} = 0$, а второе описывает $D-D$ взаимодействие внутри примитивной ячейки. Нетрудно убедиться, что ряд в правой части равенства (6) сходится абсолютно. Для оценки скорости сходимости этого ряда можно разложить выражение в фигурных скобках в ряд по степеням $\mathbf{R}_s - \mathbf{R}_t$ при $R > |\mathbf{R}_s - \mathbf{R}_t|$. Учитывая наличие центра симметрии у произвольной решетки Браве, получаем, что низший член разложения, дающий ненулевой вклад в $\hat{\gamma}(0, st)$, убывает как R^{-5} . Таким образом, зависящая от положения подрешеток часть тензора $\hat{Q}(0, st)$, т.е. $\hat{\gamma}(0, st)$, содержит вклады от взаимодействий, имеющих конечный радиус действия (второе слагаемое в (6)) и от взаимодействий, убывающих не медленнее чем R^{-5} за пределами примитивной ячейки. В результате весь вклад дальнодействующей части $D-D$ взаимодействия в регулярную часть коэффициента Фурье при $\mathbf{q} = 0$, т.е. в матрицу дипольных структурных коэффициентов для сложной решетки $\hat{Q}(0, st)$, содержится в матрице дипольных структурных коэффициентов для решетки Браве кристалла $\hat{A}(0)$.

Часто считают, что дальнодействующей является лишь та часть $D-D$ взаимодействия, которая приводит к неаналитическому поведению коэффициента Фурье $\hat{Q}(\mathbf{q})$ дипольного тензора для решетки Браве кристалла

$\hat{Q}(\mathbf{R})$, т.е. что дальнодействие связано только с макроскопическим полем, возникающим в поляризованной среде [10]. Дипольный тензор для решетки Браве кристалла определяется равенством

$$Q(\mathbf{R}) = \begin{cases} 0, & \mathbf{R} = 0, \\ \nabla_i \nabla_j \frac{1}{R} = \frac{3R_i R_j - \delta_{ij} R^2}{R^5}, & \mathbf{R} \neq 0. \end{cases} \quad (7)$$

В соответствии с (3) $Q(R)$ можно представить в виде суммы

$$Q_{ij}(\mathbf{R}) = Q_{ij}^M(\mathbf{R}) + Q_{ij}^A(\mathbf{R}), \quad (8)$$

где

$$Q_{ij}^M(\mathbf{R}) = - \left\langle e^{i\mathbf{q}\mathbf{R}} \frac{4\pi}{v_0} \frac{q_i q_j}{q^2} \right\rangle_{\text{ЗБ}} = -v_0 \int_{\text{ЗБ}} \frac{d\mathbf{q}}{(2\pi)^3} e^{i\mathbf{q}\mathbf{R}} \frac{4\pi}{v_0} \frac{q_i q_j}{q^2}, \quad (9)$$

$$Q_{ij}^A(R) = \left\langle e^{i\mathbf{q}\mathbf{R}} A_{ij}(\mathbf{q}) \right\rangle_{\text{ЗБ}}. \quad (10)$$

Область интегрирования в правой части равенства (9) ограничена первой зоной Бриллюэна (ЗБ) обратной решетки.

В работе [10] содержится утверждение, что вследствие существования и непрерывности производных всех порядков для $\hat{A}(\mathbf{q})$ убывание $\hat{Q}^A(\mathbf{R})$ при $\mathbf{R} \rightarrow \infty$ происходит быстрее любой конечной степени $1/R$. Однако из теории рядов Фурье [11] известно, что асимптотическое поведение $\hat{Q}^A(\mathbf{R})$ при $\mathbf{R} \rightarrow \infty$ определяется аналитическими свойствами периодического продолжения $\hat{A}(\mathbf{q})$ из первой ЗБ на все \mathbf{k} -пространство. Очевидно, что это периодическое продолжение $\hat{A}(\mathbf{k})$ может иметь особенности на поверхности первой ЗБ (типа скачков самой функции или ее производных), даже если $\hat{A}(\mathbf{q})$ является аналитической (целой) функцией q_x, q_y и q_z . При наличии таких особенностей $\hat{Q}^A(\mathbf{R})$ будет убывать при $\mathbf{R} \rightarrow \infty$ не быстрее некоторой конечной степени $1/R$ [11].

В Приложении показано, что для простой кубической решетки Браве $\hat{Q}^A(\mathbf{R})$ имеет при $\mathbf{R} \rightarrow \infty$ асимптотику вида

$$Q_{xy}^A(\mathbf{R}) = \text{const} \frac{(-1)^{n_x + n_y + n_z}}{R_x R_y R_z^2}, \quad (11)$$

$$Q_{xx}^A(\mathbf{R}) = \text{const} \frac{(-1)^{n_x + n_y + n_z}}{R_x^2 R_y^2 R_z^2}, \quad (12)$$

где n_x, n_y и n_z — целые числа, определяющие положение узлов простой кубической решетки: $\mathbf{R} = (n_x a, n_y a, n_z a)$, a — постоянная решетки. Отметим, что множители $(-1)^{n_i} / R_i^m$ возникают только для $n_i \neq 0$. Если $n_i = 0$, то соответствующий множитель $(-1)^{n_i} / R_i^m$ в правой части (11) или (12) отсутствует. Асимптотики для других недиагональных компонент Q_{ij}^A получаются из (11) циклической перестановкой индексов x, y и z .

Выражения (11) и (12) показывают, что 1) асимптотическое поведение $\hat{Q}^A(\mathbf{R})$ при $\mathbf{R} \rightarrow \infty$ имеет степенной характер с сильно анизотропной зависимостью от декартовых компонент R_x, R_y, R_z ; 2) вдоль главных осей кристалла $\hat{Q}^A(\mathbf{R})$ убывает медленнее, чем полный дипольный тензор $\hat{Q}(\mathbf{R})$. Таким образом, обе части дипольного тензора для решетки Браве кристалла $\hat{Q}^M(\mathbf{R})$ и $\hat{Q}^A(\mathbf{R})$ имеют дальнодействующий характер.

2. Вклад диполь-дипольного взаимодействия в $\hat{\epsilon}^\infty, \hat{Z}(s)$ и матрицу силовых постоянных кристалла

В работе [6] из точных микроскопических выражений для $\hat{\epsilon}^\infty, \hat{Z}(s)$ и регулярной при $\mathbf{q} = 0$ части матрицы силовых постоянных $\hat{\Phi}(0, st)$ [12–14] выделен вклад регулярной при $\mathbf{q} = 0$ части $D-D$ взаимодействия. Соответствующие выражения для $\hat{Z}(s)$ и $\hat{\Phi}(0, st)$ (выражения (24), (25) и (36) работы [6]) содержат матрицу дипольных структурных констант для сложной решетки $\hat{Q}(0, st)$. Учитывая результаты предыдущего раздела, можно, используя выражение (4) для $\hat{Q}(0, st)$, выделить вклад дальнодействующей части $D-D$ взаимодействия, которой соответствует матрица дипольных структурных констант для решетки Браве кристалла $\hat{A}(0)$. Оставшуюся часть $\hat{Q}(0, st)$, описываемую матрицей $\hat{\gamma}(0, st)$, следует включить в близкодействующую часть кулоновского взаимодействия (межъядерного и электрон-ядерного).

В результате, повторяя преобразования работы [6] и восстанавливая тензорные (матричные) обозначения для всех величин, находим для тензора электронной (оптической) диэлектрической проницаемости $\hat{\epsilon}^\infty$ следующее выражение:

$$\epsilon_{ij}^\infty = \delta_{ij} + \frac{4\pi}{v_0} \left[\left(\hat{I} - \hat{\alpha}^e \hat{A}(0) \right)^{-1} \hat{\alpha}^e \right]_{ij}, \quad (13)$$

где $\hat{\alpha}^e$ — тензор эффективной электронной поляризуемости кристалла, определяемый выражением (19) работы [6], а \hat{I} — единичный оператор.

Для тензора макроскопического эффективного заряда $\hat{Z}(s)$ получаем следующее выражение:

$$Z_{ij}(s) = \left[\left(\hat{I} - \hat{\alpha}^e \hat{A}(0) \right)^{-1} \right]_{ik} \zeta_{kj}(s), \quad (14)$$

где $\hat{\zeta}(s)$ — вклад близкодействия в $\hat{Z}(s)$, который можно получить, заменив в выражении (24) работы [6] для $\hat{Z}(s)$ все операторы \hat{Q} на \hat{N} и добавив к выражению в квадратных скобках слагаемое $A_{...,k}^{m,1}(0) \gamma_{kj}(0, os)$.

Учитывая (13), получаем из (14) следующее выражение для $\hat{Z}(s)$:

$$Z_{ij}(s) = \left[\left(\hat{\epsilon}^\infty - \hat{I} \right) \hat{A}(0) \frac{v_0}{4\pi} + \hat{I} \right]_{ik} \zeta_{kj}(s). \quad (15)$$

Выражение для вклада дальнодействующей части $D-D$ взаимодействия в регулярную при $\mathbf{q} = 0$ часть матрицы силовых постоянных $\hat{\Phi}^{DD}(st)$, учитывая (14), можно представить в следующем виде:

$$\begin{aligned}\hat{\Phi}^{DD}(st) &= -\epsilon^2 \hat{\zeta}^+(s) \left(\hat{I} - \hat{A}(0) \hat{\alpha}^\epsilon \right)^{-1} \hat{A}(0) \hat{\zeta}(t) = \\ &= -\epsilon^2 \hat{Z}^+(s) \hat{A}(0) \left(\hat{I} - \hat{\alpha}^\epsilon \hat{A}(0) \right) \hat{Z}(t).\end{aligned}\quad (16)$$

Учитывая (13), можно преобразовать выражение (16) к виду

$$\bar{\Phi}_{ij}^{DD}(st) = -\frac{4\pi\epsilon^2}{v_0} \sum_{k,l} Z_{ki}(s) B_{kl} Z_{lj}(t), \quad (17)$$

где

$$\hat{B} = \left(\frac{v_0}{4\pi} \hat{A}(0) (\hat{\epsilon}^\infty - I) + \hat{I} \right)^{-1} A(0) \frac{v_0}{4\pi}. \quad (18)$$

Тензор $\hat{A}(\mathbf{q})$, определяемый для произвольной решетки Браве выражением (3), обладает следующими очевидными свойствами:

$$A_{ij}(\mathbf{q}) = A_{ji}(\mathbf{q}), \quad A_{ij}(-\mathbf{q}) = A_{ij}(\mathbf{q}), \quad \sum_i A_{ii}(\mathbf{q}) = \frac{4\pi}{v_0}. \quad (19)$$

Для кубических решеток Браве [1]

$$A_{ij}(0) = \frac{4\pi}{3v_0} \delta_{ij}, \quad (20)$$

и соответственно для кристаллов, относящихся к кубическим классам симметрии, выражения (13), (15) и (17), (18) принимают вид

$$\epsilon_\infty = 1 + \frac{4\pi}{v_0} \alpha^\epsilon \left(1 - \frac{4\pi}{3v_0} \alpha^\epsilon \right)^{-1}, \quad (21)$$

$$Z_{ij}(s) = \frac{\epsilon_\infty + 2}{3} \zeta_{ij}(s), \quad (22)$$

$$\bar{\Phi}_{ij}^{DD}(st) = -\frac{4\pi\epsilon^2}{v_0} \frac{\sum_k Z_{ki}(s) Z_{kj}(t)}{\epsilon_\infty + 2}. \quad (23)$$

Выражения (22) и (23) были получены ранее в работе [6] для двухатомных кубических кристаллов.

Учитывая результаты работы [6] и выражения (17), (18) для $\hat{\Phi}_{ij}^{DD}(st)$, можно представить полный вклад дальнодействующей части $D-D$ взаимодействия в матрицу силовых постоянных кристалла в длинноволновой области $\mathbf{q} \rightarrow 0$ в следующем виде:³

$$\Phi_{ij}^{DD}(\mathbf{q} \rightarrow 0, st) = \bar{\Phi}_{ij}^{DD}(0, st) + \Phi_{ij}^M(\mathbf{n}, st) = \frac{4\pi\epsilon^2}{v_0} \sum_{kl} Z_{ki}(s) C_{kl}(\mathbf{n}) Z_{lj}(t), \quad (24)$$

³ Длинноволновый предел $\mathbf{q} \rightarrow 0$ означает выполнение условия $qa \ll 1$, где a — постоянная решетки, при естественном для рассмотрения объемных свойств ограничении $qL \gg 1$, где L — минимальный размер кристалла.

где

$$C_{kl}(\mathbf{n}) = -B_{kl} + \frac{n_k n_l}{\varepsilon_{\infty}^{LL}(\mathbf{n})}, \quad \mathbf{n} = \mathbf{q}/q, \quad (25)$$

$$\varepsilon_{\infty}^{LL}(\mathbf{n}) = \sum_{ij} \varepsilon_{ij}^{\infty} n_i n_j. \quad (26)$$

Для кристаллов, относящихся к кубическим классам симметрии, имеем

$$C_{kl}(\mathbf{n}) = -\frac{\delta_{kl}}{\varepsilon_{\infty} + 2} + \frac{n_k n_l}{\varepsilon_{\infty}}. \quad (27)$$

Второе слагаемое в правой части (25) и (27) соответствует вкладу возникающего при полярных оптических колебаниях решетки макроскопического поля в полную силовую матрицу. Источником этого макроскопического поля является неаналитическая при $\mathbf{q} = 0$ часть коэффициента Фурье дипольного тензора. Первое слагаемое в (25), (27) соответствует дипольному вкладу в $\hat{\Phi}$, источником которого является регулярная при $\mathbf{q} = 0$ часть $\hat{A}(\mathbf{q})$ коэффициента Фурье дипольного тензора для решетки Браве кристалла. Хотя этот вклад в матрицу силовых постоянных имеет микроскопическую природу, он, как и вклад макроскопического поля, содержит макроскопические параметры $\hat{\varepsilon}^{\infty}$ и $\hat{Z}(s)$.

Как уже упоминалось выше, в общем случае имеется также близкодействующая часть $D-D$ взаимодействия, описываемая матрицей $\hat{\gamma}(0, st)$, зависящей от взаимного положения подрешеток s и t . Вообще говоря, вклад этой части $D-D$ взаимодействия следует учитывать наряду с другими вкладами близкодействия в $\hat{\Phi}(st)$. Однако в многоатомных кристаллах с большими размерами примитивной ячейки, значительно превышающими межатомные расстояния, необходимо иметь в виду, что второе слагаемое в правой части выражения (6) для $\hat{\gamma}(st)$ ведет себя как $|\mathbf{R}_s - \mathbf{R}_t|^{-3}$ в пределах примитивной ячейки, что затрудняет описание этого взаимодействия в рамках метода силовых постоянных. В этом случае могут быть полезны грубые оценки вклада $D-D$ взаимодействия, обусловленного матрицей $\hat{\gamma}$, в матрицу силовых постоянных. Для таких оценок можно использовать, например, выражение для этого вклада в модели поляризуемых ионов из работы [5]

$$\Phi_{ij}^{\gamma}(0, st) = -e^2 \sum_{u, k} z^{\text{ion}}(u) \left(\hat{I} - \hat{\gamma} \hat{\alpha} \right)_{ik}^{us} T_{kj}^{st}, \quad (28)$$

где

$$T_{kj}^{st} = \left[\left(\hat{I} - \hat{\gamma} \hat{\alpha} \right)^{-1} \hat{\gamma} \right]_{kj}^{st} z^{\text{ion}}(t) - \sum_l \left[\left(\hat{I} - \hat{\gamma} \hat{\alpha} \right)^{-1} \right]_{kl}^{st} \sum_v \gamma_{lj}(tv) z^{\text{ion}}(v). \quad (29)$$

Здесь $z^{\text{ion}}(s)$ — заряд иона в подрешетке s , а $\alpha_{ij}(st) = \delta_{st} \alpha_{ij}(s)$, где $\alpha_{ij}(s)$ — тензор электронной поляризуемости иона в подрешетке s . Отметим, что в соответствующем выражении (2.14) в работе [5] был потерян знак «минус» перед всем выражением для $\hat{\Phi}^{\gamma}(st)$.

3. Вклад дальнодействующей части $D-D$ взаимодействия в дисперсионные частоты длинноволновых полярных оптических колебаний решетки

В полярных кристаллах фононный вклад в тензор диэлектрической проницаемости $\hat{\epsilon}(\omega)$ можно представить в виде [1,15]

$$\epsilon_{ij}(\omega) - \epsilon_{ij}^{\infty} = \sum_{\alpha} \frac{f_{ij}(\alpha)}{\bar{\omega}^2(\alpha) - \omega^2 - 2i\omega\gamma(\alpha, \omega)}, \quad (30)$$

где $\hat{f}(\alpha)$ — тензор дипольных сил осциллятора для моды α

$$f_{ij}(\alpha) = \frac{4\pi e^2}{v_0} \xi_i^*(\alpha) \xi_j(\alpha), \quad (31)$$

$$\xi_j(\alpha) = \sum_{s,k} Z_{jk}(s) \frac{\bar{e}_k(\alpha, s)}{\sqrt{M_s}}. \quad (32)$$

Дисперсионные частоты $\bar{\omega}(\alpha)$ и векторы поляризации $\bar{e}(\alpha, s)$ являются собственными значениями и собственными векторами динамической матрицы, соответствующей «механической» (регулярной при $\mathbf{q} = 0$) части матрицы силовых постоянных $\hat{\Phi}(0, st)$, т.е. являются решениями динамического уравнения

$$\bar{\omega}^2(\alpha) \bar{e}_i(\alpha, s) = \sum_{t,j} \bar{\Phi}_{ij}(0, st) (M_s M_t)^{-1/2} \bar{e}_j(\alpha, t), \quad (33)$$

где M_s — масса атомного ядра для атомов из подрешетки s .

Учитывая, что матрицу $\hat{\Phi}(0, st)$ можно представить в виде суммы

$$\hat{\Phi}(0, st) = \hat{\Phi}^{sr}(0, st) + \hat{\Phi}^{DD}(0, st), \quad (34)$$

где $\hat{\Phi}^{sr}$ — вклад близкодействующей части взаимодействия ядер и электронов кристалла [6], находим из (33) и (34), что

$$\bar{\omega}^2(\alpha) = \omega_{sr}^2(\alpha) + \bar{\omega}_{DD}^2(\alpha). \quad (35)$$

Выражение для $\bar{\omega}_{DD}^2(\alpha)$, учитывая уравнение (33) и свойство ортонормированности векторов $\bar{e}(\alpha, s)$, можно представить в виде

$$\bar{\omega}_{DD}^2(\alpha) = \sum_{ij} \frac{\bar{e}_i^*(\alpha, s)}{\sqrt{M_s}} \bar{\Phi}_{ij}^{DD}(st) \frac{\bar{e}_j(\alpha, t)}{\sqrt{M_t}}. \quad (36)$$

Учитывая выражение (17) для $\hat{\Phi}^{DD}$ и соотношения (31) и (32), находим в результате

$$\bar{\omega}_{DD}^2(\alpha) = - \sum_{ij} B_{ij} f_{ij}(\alpha), \quad (37)$$

где (см. (18))

$$B_{ij} = \left\{ \left[\frac{v_0}{4\pi} \hat{A}(0) (\hat{\varepsilon}^\infty - \hat{I}) + \hat{I} \right]^{-1} \hat{A}(0) \right\}_{ij} \frac{v_0}{4\pi}. \quad (38)$$

Для кристаллов, относящихся к кубическим классам симметрии, учитывая (20), находим

$$B_{ij} = -\frac{\delta_{ij}}{\varepsilon_\infty + 2}, \quad (39)$$

и соответственно

$$\bar{\omega}_{DD}^2(\alpha) = -\frac{f(\alpha)}{\varepsilon_\infty + 2}; \quad f(\alpha) = \sum_i f_{ii}(\alpha). \quad (40)$$

Описываемый выражениями (37)–(40) вклад дальнодействующей, регулярной при $\mathbf{q} = 0$ части D – D взаимодействия в частоты длинноволновых оптических колебаний решетки $\bar{\omega}(\alpha)$ отличен от нуля только для полярных колебаний, для которых $f_{ij}(\alpha) \neq 0$, и всегда уменьшает частоты $\bar{\omega}(\alpha)$ (в области устойчивости решетки). Существенно, что этот вклад является модельно-независимым, так как содержит только экспериментально измеримые величины $\hat{\varepsilon}^\infty$ и $\hat{f}(\alpha)$ и (обладающей макроскопической симметрией) тензор дипольных структурных констант для решетки Браве кристалла $\hat{A}(0)$, который можно найти с помощью метода Эвальда [1,2]. Вклад в $\bar{\omega}(\alpha)$ оставшейся, близкодействующей части D – D взаимодействия, описываемой матрицей $\hat{\gamma}(0, st)$, вообще говоря, отличен от нуля для всех длинноволновых оптических мод, может быть как положительным, так и отрицательным и является модельно-зависимым.

Приведенные выше результаты получены в гармоническом приближении. Можно, однако, показать [3], что эти результаты сохраняют силу во всех порядках по ангармоническому взаимодействию фононов и электрон-фононному взаимодействию и справедливы при конечных температурах с заменой $\hat{\varepsilon}^\infty$, $\hat{Z}(s)$ и $\bar{\omega}(\alpha)$ на соответствующие температурно- зависящие величины. При этом под частотами $\bar{\omega}(\alpha, T)$ следует понимать решения динамического уравнения (33), в котором $\hat{\Phi}(0, st)$ заменена на эффективную, зависящую от температуры матрицу силовых постоянных

$$\hat{\Phi}^{\text{eff}}(0, st) = \hat{\Phi}(0, st) + \text{Re } \hat{\Sigma}^{\text{ph}}(0, \omega = 0; st), \quad (41)$$

где

$$\hat{\Sigma}^{\text{ph}}(\mathbf{q}, \omega; st)$$

— оператор собственной энергии фононов, учитывающий влияние ангармонизма колебаний решетки на фоновый спектр [8,15].

Определенные таким образом частоты $\bar{\omega}(\alpha, T)$ входят в точное выражение для тензора статической диэлектрической проницаемости $\hat{\varepsilon}(0)$, т.е. являются обобщенными дисперсионными частотами. Заметим также, что именно частоты $\bar{\omega}(\alpha, T)$ определяются из эксперимента при обработке оптических экспериментов по формуле (30) для $\hat{\varepsilon}(\omega)$ при условии слабой частотной дисперсии $\text{Re } \hat{\Sigma}^{\text{ph}}(\omega)$ и независимо от того, имеют ли соответствующие возбуждения резонансный ($\gamma(\alpha) < \bar{\omega}(\alpha)$) или релаксационный ($\gamma(\alpha) > \bar{\omega}(\alpha)$) характер.

4. Расчеты вкладов дипольных и близкодействующих сил в дисперсионные частоты для SrTiO₃, KTaO₃, KCoF₃ и кубической фазы BaTiO₃ и KNbO₃

Начиная с работы Слейтера [16], во многих работах обсуждался классический дипольный механизм сегнетоэлектрической неустойчивости решетки в оксидах переходных металлов со структурой перовскита [5]. Слабой стороной теории Слейтера [16] является использование модели поляризуемых сферически-симметричных ионов, не адекватной для описания электронного отклика в оксидах переходных металлов со структурой перовскита, поскольку 1) связь в комплексах M₆O₆ (M — переходный металл) является ковалентно-ионной [17–19], что ясно уже из подсчета числа валентных электронов, которые отдает переходный металл на одну связь; 2) большая электронная поляризуемость этих соединений связана скорее с сильно анизотропной поляризуемостью связей в цепочках M—O—M [18,19], чем с изотропной поляризуемостью ионов кислорода. Полученное выше выражение (40) для $\bar{\omega}_{DD}^2$ позволяет проанализировать роль дипольных сил в возникновении сегнетоэлектричества в соединениях со структурой перовскита, вообще не обращаясь к модельному описанию D—D взаимодействия, используя лишь экспериментальные значения ε_∞ , $\bar{\omega}(\alpha)$ и дипольных сил осциллятора $f(\alpha)$, известные для многих оксидов и фторидов переходных металлов, имеющих кубическую структуру перовскита, из оптических экспериментов.

В табл. 1 приведены экспериментальные значения электронной диэлектрической проницаемости ε_∞ , дисперсионных частот $\bar{\omega}(\alpha)$ и дипольных сил осциллятора $f(\alpha)$ для трех полярных оптических мод симметрии F_{1u} для соединений BaTiO₃, SrTiO₃, KNbO₃, KTaO₃ и KCoF₃. Значения $\bar{\omega}(\alpha)$ и $f(\alpha)$ взяты из работ [20–23] (отражение света в инфракрасной области спектра) и [24–26] (гиперрамановское рассеяние света). Для KCoF₃ изменен порядок следования мод 1 и 2, поскольку, согласно [27], именно

Таблица 1

Электронная диэлектрическая проницаемость ε_∞ , дисперсионные частоты $\bar{\omega}(\alpha)$ и дипольные силы осциллятора $f(\alpha)$ полярных оптических мод для нескольких кубических перовскитов

Соединение	ε_∞ [27]	$\bar{\omega}(1)$, см^{-1}	$f(1)$, 10^5 см^{-2}	$\bar{\omega}(2)$, см^{-1}	$f(2)$, 10^5 см^{-2}	$\bar{\omega}(3)$, см^{-1}	$f(3)$, 10^5 см^{-2}
BaTiO ₃ (473 K)	5.3	42 [20] 31 [24]	22.0 —	182 —	0.73 —	500 —	2.0 —
SrTiO ₃ (300 K)	5.2	86 [20]	22.9	176	1.1	544	4.62
KNbO ₃ (710 K)	5.76	96 [21] 30 [25]	21.2 —	198 —	2.16 —	521 —	8.41 —
KTaO ₃ (300 K)	4.35	85 [22] 81 [26]	15.1 15.3	199	1.98 2.57	549 546	7.23 7.45
KCoF ₃ (300 K)	2.07	225 [23]	1.1	139	0.38	417	1.44

Вычисленные по формулам (40) и (35) и данным из табл. 1 значения $|\bar{\omega}_{DD}(\alpha)|$ и отношения $\bar{\omega}_{DD}^2(\alpha)/\omega_{sr}^2(\alpha)$ для поперечных полярных оптических мод в нескольких кубических перовскитах. Для моды 1 в BaTiO₃, KNbO₃ и KTaO₃ использованы значения $\bar{\omega}(1)$ из табл. 1, полученные методом гиперрамановской спектроскопии [24–26]

Соединение	$ \bar{\omega}_{DD}(1) $, см ⁻¹	$\frac{\bar{\omega}_{DD}^2(1)}{\omega_{sr}^2(1)}$	$ \bar{\omega}_{DD}(2) $, см ⁻¹	$\frac{\bar{\omega}_{DD}^2(2)}{\omega_{sr}^2(2)}$	$ \bar{\omega}_{DD}(3) $, см ⁻¹	$\frac{\bar{\omega}_{DD}^2(3)}{\omega_{sr}^2(3)}$
BaTiO ₃	549	-0.997	100	-0.23	165	-0.10
SrTiO ₃	564	-0.977	124	-0.33	253	-0.18
KNbO ₃	522	-0.997	167	-0.42	329	-0.28
KTaO ₃	491	-0.975	177	-0.44	338	-0.27
KCoF ₃	166	-0.35	96	-0.32	188	-0.17

мода с частотой 225 см⁻¹ является модой слейтеровского типа, соответствующей относительному движению подрешетки В и трех кислородных подрешеток.

В табл. 2 приведены рассчитанные по формулам (40) и (35) и экспериментальным данным из табл. 1 значения $|\bar{\omega}_{DD}(\alpha)|$ и отношение $\bar{\omega}_{DD}^2(\alpha)/\omega_{sr}^2(\alpha)$. Из табл. 2 видно, что для низкочастотной моды 1 слейтеровского типа [27] в оксидах Ti, Nb и Ta имеет место почти полная компенсация вкладов близкодействия и дипольных сил. Это указывает на справедливость гипотезы Слейтера [16] о дипольном механизме сегнетоэлектрической неустойчивости решетки в оксидах переходных металлов с кубической структурой перовскита и на доминирующую роль в дипольном механизме неустойчивости дальнодействующей части D–D взаимодействия.

В табл. 3 приведены значения эффективных силовых постоянных κ_{DD} и κ_{sr} для мод 1, 2 и 3 и соответствующие безразмерные силовые постоянные $\kappa(\alpha)/\kappa_0$, которые определяются следующими выражениями:

$$\kappa_{sr}(\alpha) = \mu_\alpha \omega_{sr}^2(\alpha), \quad \kappa_{DD}(\alpha) = \mu_\alpha \bar{\omega}_{DD}^2(\alpha), \quad \kappa_0 = \frac{4\pi e^2}{v_0}, \quad (42)$$

где μ_α — приведенные массы, определяемые для соединения ABX₃ выражениями

$$\mu_1 = \frac{3M_B M_X}{M_B + 3M_X}, \quad \mu_2 = \frac{M_A(M_B + 3M_X)}{M_A + M_B + 3M_X}, \quad \mu_3 = \frac{2}{3} M_X. \quad (43)$$

Такой выбор приведенных масс μ_α соответствует предложению, что моды 1, 2 и 3 являются в первом приближении колебаниями типа В—O₃, A—BO₃ и O₁—O_{II,III} соответственно, т.е. типа S₁, S₂ и S₃ в обозначениях работы [27].

Для сравнения в табл. 3 приведены также значения соответствующих величин для трех одномодовых двухатомных кубических кристаллов, имеющих высокую электронную поляризуемость ($\epsilon_\infty(\text{SnTe}) = 40$, $\epsilon_\infty(\text{BaO}) = 4$ и $\epsilon_\infty(\text{TiCl}) = 5$), вычисленных с использованием экспериментальных данных для BaO из работы [28] и результатов работы [29].

Таблица 3

Вычисленные по формулам (42) и (43) и данным из табл. 2 вклады в эффективные силовые постоянные поперечных полярных оптических мод сил близкодействия $\chi_{sr}(\alpha)$ и дипольных сил $\chi_{DD}(\alpha)$, их отношение к $\chi_0 = 4\pi e^2/v_0$ и значения χ_0 для нескольких кубических перовскитов и аналогичные величины для поперечных оптических мод в некоторых двухатомных кубических соединениях

Соединение	α	$\chi_{sr}, \text{ эВ/А}^2$	$\chi_{DD}, \text{ эВ/А}^2$	$\frac{\chi_{sr}}{\chi_0}$	$\frac{\chi_{DD}}{\chi_0}$	$\chi_0, \text{ эВ/А}^2$
BaTiO ₃	1	26.90	-26.82	9.51	-9.46	
	2	9.2	-2.1	3.3	-0.72	2.82
	3	13.8	-2.46	4.6	-0.82	
SrTiO ₃	1	28.6	-27.9	9.4	-9.2	
	2	8.1	-2.7	2.7	-0.9	3.0
	3	14.85	-3.1	5.0	-1.0	
KNbO ₃	1	32.0	-31.9	11.54	-11.5	
	2	7.6	-3.16	2.74	-1.14	2.78
	3	15.0	-4.3	5.4	-1.54	
KTaO ₃	1	34.7	-33.8	12.20	-11.9	
	2	8.8	-3.86	3.1	-1.36	2.84
	3	16.7	-4.5	5.9	-1.6	
KCoF ₃	1	8.5	-3.0	2.95	-1.04	
	2	9.1	-2.96	3.25	-1.06	2.8
	3	8.3	-1.4	2.96	-0.5	
Sn _{0.984} Te	1	4.45	-4.4	1.465	-1.45	4.2
BaO	1	6.76	-5.74	1.66	-1.36	4.25
TiCl	1	2.53	-2.14	0.78	-0.66	3.25

Из табл. 3 видно, что в оксидах Ti, Nb и Ta, имеющих кубическую структуру перовскита, вклад дипольных сил в эффективную силовую постоянную низкочастотной моды I слейтеровского типа аномально велик как по сравнению с остальными полярными модами в этих соединениях, так и по сравнению с модой слейтеровского типа в KCoF₃ или с мягкой сегнетоэлектрической модой в соединениях A^{IV}B^{VI} [29]. Из выражений (40), (31) и (32) следует, что аномально большая величина $\chi_{DD}(1)/\chi_0$ является следствием больших значений макроскопических эффективных зарядов $Z(B) \approx 7$ и $Z_{||}(O) \approx -6$ в оксидах Ti, Nb и Ta [27] при сравнительно невысокой электронной поляризуемости (в SnTe макроскопический поперечный эффективный заряд тоже велик $Z \approx 8$ [29], однако при аномально большой электронной поляризуемости $\epsilon_\infty \approx 40$).

В заключение считаю своим приятным долгом поблагодарить А. Н. Лазарева за внимание к работе и полезные обсуждения результатов, а также А. К. Таганцева за стимулирующие дискуссии по теме работы.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Учитывая аналитичность $\hat{A}(\mathbf{q})$ как функции q_x , q_y и q_z из (19), можно разложить $\hat{A}(\mathbf{q})$ в ряд Маклорена вида

$$A_{ij}(\mathbf{q}) = A_{ij}(0) + \sum_{m=1}^{\infty} C_{ij k_1 \dots k_{2m}}^{(2m)} q_{k_1} \dots q_{k_{2m}}, \quad (\text{П.1})$$

содержащий только четные члены разложения.

Для простой кубической решетки $\mathbf{R} = (n_x a, n_y a, n_z a)$, где a — постоянная решетки,

$$\begin{aligned} Q_{ij}^A(\mathbf{R}) = & \frac{a^3}{(2\pi)^3} \int_{-\pi/a}^{\pi/a} dq_x dq_y dq_z A_{ij}(q_x, q_y, q_z) \times \\ & \times \exp[i(q_x n_x + q_y n_y + q_z n_z)a]. \end{aligned} \quad (\text{П.2})$$

Подставим разложение (П.1) в (П.2). Учитывая, что диагональные компоненты $A_{ii}(\mathbf{q})$ являются четными функциями q_x , q_y и q_z , а недиагональные компоненты $A_{ij}(\mathbf{q})$ являются нечетными функциями q_i и q_j и четными функциями третьей компоненты волнового вектора, находим, что члены разложения (П.1) для диагональных и недиагональных компонент $A_{ij}(\mathbf{q})$, например для A_{xx} и A_{xy} , имеет вид

$$A_{xx}^{(2m)}(\mathbf{q}) = \sum_{l,p,r} C^{(2m)}(l, p, r) q_x^{2l} q_y^{2p} q_z^{2r}, \quad (\text{П.3})$$

где $l, p, r \geq 0$ и $l + p + r = m$, и

$$A_{xy}^{(2m)}(\mathbf{q}) = \sum_{l,p} C^{(2m)}(l, p) q_x^{2l+1} q_y^{2l+1} q_z^{2p}, \quad (\text{П.4})$$

где $l, p \geq 0$ и $2l + p + 1 = m$.

Таким образом, учитывая (П.2) и (П.1), (П.3), (П.4), находим, что задача сводится к изучению асимптотического поведения при $|n| \rightarrow \infty$ одномерных интегралов вида

$$I_p(n) = \int_{-\pi}^{\pi} dx e^{inx} x^p. \quad (\text{П.5})$$

При $n \neq 0$

$$I_p(n) = \begin{cases} 0, & p = 0, \\ n^{-p-1} J_p(n), & p \geq 1, \end{cases} \quad (\text{П.6})$$

$$J_p(n) = \int_{-n\pi}^{n\pi} dx e^{ix} x^p. \quad (\text{П.7})$$

Используя известное выражение для стандартного интеграла в правой части равенства (П.7) [30], находим следующее асимптотическое выражение для $I_p(n)$ для $p \geq 1$ при $|n| \rightarrow \infty$:

$$I_p(n) = b(p) \begin{cases} \frac{(-1)^n}{n}, & p = 2l + 1, \\ \frac{(-1)^n}{n^2}, & p = 2l, \end{cases} \quad (\text{П.8})$$

где $b(p)$ — множитель, зависящий от p , но не зависящий от n .

Рассмотрим случай общего положения, $n_x \neq 0$, $n_y \neq 0$ и $n_z \neq 0$. В этом случае, учитывая сказанное выше и (П.8), находим, что все члены разложения (П.1), (П.3), (П.4), начиная с $m = 2$ для A_{xy} и с $m = 3$ для A_{xx} , дают вклад в $\hat{Q}^A(\mathbf{R})$, имеющий при $\mathbf{R} \rightarrow \infty$ асимптотику вида

$$Q_{xy}^A(\mathbf{R}) : \text{const} \frac{(-1)^{n_x+n_y+n_z}}{R_x R_y R_z^2}, \quad (\text{П.9})$$

$$Q_{xx}^A(\mathbf{R}) : \text{const} \frac{(-1)^{n_x+n_y+n_z}}{R_x^2 R_y^2 R_z^2}. \quad (\text{П.10})$$

Учитывая (П.5), нетрудно увидеть, что в случае обращения в нуль какого-либо индекса n_i соответствующий множитель $(-1)^{n_i}/R_i^p$ отсутствует в (П.9) и (П.10). С учетом этого замечания все члены разложения (П.1) дают вклады в $Q_{ij}^A(\mathbf{R})$, имеющие одну и ту же асимптотику вида (П.9) и (П.10) при $\mathbf{R} \rightarrow \infty$, откуда следует, что выражения (11) и (12) в тексте работы описывают асимптотическое поведение $\hat{Q}^A(\mathbf{R})$ при $\mathbf{R} \rightarrow \infty$.

Список литературы

- [1] Борн М., Хуан Кунь. Динамическая теория кристаллических решеток. М.: ИЛ, 1958.
- [2] Maradudin A.A., Montroll E.W., Weiss G.H., Ipatova I.P. Theory of Lattice Dynamics in the Harmonic Approximation. New York: Academic Press, 1971.
- [3] Агранович В.М., Галанин М.Д. Перенос энергии электронного возбуждения в конденсированных средах. М.: Наука, 1978.
- [4] Cochran W. // Adv. Phys. 1960. V. 9. N 36. P. 387–423.
- [5] Квятковский О.Е., Максимов Е.Г. // УФН. 1988. Т. 154. № 1. С. 3–48.
- [6] Квятковский О.Е. // ФТТ. 1985. Т. 27. № 9. С. 2673–2682.
- [7] Гуревич В.Л. Кинетика фононных систем. М.: Наука, 1980.
- [8] Абрикосов А.А., Горьков Л.П., Дзялошинский И.Е. Методы квантовой теории поля в статистической физике. М.: ГИФМЛ, 1962.
- [9] Квятковский О.Е. // Автореф. канд. дис. Л., 1986.
- [10] Maradudin A.A. // Dynamical Properties of Solids. V. 1. Crystalline Solids, fundamentals / Ed. G.K. Horton, A.A. Maradudin. Amsterdam: North-Holland PC, 1974. P. 3–82.
- [11] Смирнов В.И. Курс высшей математики. Т. 2. М.: Наука, 1967.
- [12] Sham L.J. // Phys. Rev. 1963. V. 188. N 3. P. 1431–1439.
- [13] Pick R.M., Cohen M.H., Martin R.M. // Phys. Rev. B. 1970. V. 1. N 2. P. 910–920.
- [14] Квятковский О.Е. Динамическая теория и физические свойства кристаллов / Под ред. А.Н. Лазарева. Санкт-Петербург: Наука, 1992. С. 5–40.
- [15] Gowley R.A. // Adv. Phys. 1963. V. 12. N 48. P. 421–480.
- [16] Slater J.C. // Phys. Rev. 1950. V. 78. N 6. P. 748–761.
- [17] Толпиго К.Б. // ФТТ. 1990. Т. 32. № 8. С. 2205–2211.

- [18] Weyrich K.H., Madenach R.P. // Ferroelectrics. 1990. V. 42. N 10. P. 6416–6423.
- [19] Cohen R.E., Krakauer H. // Phys. Rev. B. 1990. V. 42. N 10. P. 6416–6423.
- [20] Barker A.S., Jr. // Phys. Rev. 1966. V. 145. N 2. P. 391–399.
- [21] Fontana M.D., Matrat G., Servoin J.L., Gervais F. // J. Phys. C. 1984. V. 17. N 3. P. 488–514.
- [22] Miller R.C., Spitzer W.G. // Phys. Rev. 1963. V. 129. N 1. P. 94–98.
- [23] Axe J.D., Pettit G.D. // Phys. Rev. 1967. V. 157. N 2. P. 435–437.
- [24] Vogt H., Sanjurjo J.A., Rossbroich G. // Phys. Rev. B. 1982. V. 26. N 10. P. 5904–5910.
- [25] Vogt H., Fontana M.D., Kugel G.E., Gunter P. // Phys. Rev. B. 1986. V. 34. N 1. P. 410–415.
- [26] Vogt H., Uwe H. // Phys. Rev. B. 1984. V. 29. N 2. P. 1030–1034.
- [27] Axe J.D. // Phys. Rev. 1967. V. 157. N 2. P. 429–435.
- [28] Квятковский О.Е. // ФТТ. 1986. Т. 28. № 4. С. 983–990.
- [29] Chang S.S., Tompson C.W., Gurmen E., Muhlestein L.D. // J. Phys. Chem. Solids. 1975. V. 36. N 7/8. P. 769–773.
- [30] Прудников А.П., Брычков Ю.А., Маричев О.И. Интегралы и ряды (элементарные функции). М.: Наука, 1981.

Институт химии силикатов
им. И. В. Гребенщикова РАН
Санкт-Петербург

Поступило в Редакцию
9 марта 1993 г.